

光谱学与光谱分析

偏振差分反射光谱研究半导体材料的平面内光学各向异性

赵雷¹,陈涌海²,左玉华¹,王海宁³,时文华¹

1. 中国科学院半导体研究所, 集成光电子国家重点联合实验室, 北京 100083
2. 中国科学院半导体研究所, 半导体材料科学重点实验室, 北京 100083
3. 中国科学院电子学研究所, 传感技术国家重点实验室, 北京 100080

收稿日期 2005-5-16 修回日期 2005-8-26 网络版发布日期 2006-6-26

摘要 介绍了偏振差分反射光谱的原理, 并结合半导体材料平面内光学各向异性的来源, 总结了偏振差分反射光谱作为一种重要的表面、界面分析技术在半导体材料研究中的应用, 并分析指出其在Si基材料电光改性研究中将会起到重要作用。

关键词 [偏振差分反射光谱](#) [半导体](#) [平面内光学各向异性](#) [电光改性](#)

分类号 [O433, TN301.1](#)

DOI:

通讯作者:
赵雷

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(988KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“偏振差分反射光谱”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

· [赵雷](#)

· [陈涌海](#)

· [左玉华](#)

· [王海宁](#)

· [时文华](#)